「Microscopy」Editor's choice 論文ミニアブストラクトの掲載について

藤吉好則(「Microscopy」編集委員長)^{a, b}, 樋田一徳(「顕微鏡」編集委員長)^{c, d}

^a名古屋大学大学院創薬科学研究科 ^b名古屋大学細胞生理学研究センター ^c川崎医科大学解剖学 ^d川崎医科大学組織電子顕微鏡センター

このたび「顕微鏡」に「Microscopy」Editor's choice の論文のミニアブストラクトを毎号, 定期的に掲載することとなりました. Microscopy では毎号1編の割合で, Editor's choice として選定された優れた論文を free-access*(* 購読していない研究機関・ 研究者であっても自由にダウンロードすることができるシステム)とし,その内容の周知に努めてきました.このように Editor's choice として選ばれた優れた論文がさらに多くの方の眼に触れる事を期待して,日本語のミニアブストラクトを和文誌 に掲載する事といたしました.この試みによって,Microscopy の論文をさらに多くの方々に読んでいただけるようになり,更 に読者の皆様がご自分の論文を書かれる際に,Microscopy 掲載論文の引用が増加することを願っております.今回,和文誌「顕 微鏡」と欧文誌「Microscopy」が共同でこのような目的に向けて企画を行いましたので,ぜひこの機会に Microscopy に掲載さ れた優れた論文のエッセンスをご覧ください.

また, Editorial Board としては, 論文の査読時間を短くするように全力で取り組んでおります. それゆえ, Editor's choice に 選ばれるような良い論文をふるって Microscopy に投稿していただき, free-access となるような論文として, 世界に向けて発信 していただければと願っております. 投稿に関するお問い合わせは日本語でもできますので, 遠慮なくお問い合わせをいただ きたいと思います. そして, 良い論文を Microscopy に投稿していただき, 日本顕微鏡学会の雑誌をさらに発展させていただき ますようお願いいたします.



年 6 回発行 Impact Factor: 1.438* www.jmicro.oxfordjournals.org

顕微鏡科学分野における世界のリーダーシップを目指して

日本顕微鏡学会の「Microscopy」は、あらゆるタイプの顕微鏡による研究 成果を対象とする英文学術誌です。2013年、誌名を Journal of Electron Microscopy (JEM)から Microscopy に改め、顕微鏡科学分野における世 界のリーディングジャーナルとして、JEM の使命を受け継ぎつつ、顕微 鏡全般に関する研究を迅速に世界に発信しています。

日本顕微鏡学会会員の皆様は、Microscopy のバックナンバー(1953年以降) から最新号までの全てを、ウェブ上で閲覧、ダウンロードできます、学会 よりご案内しております User Name、Password をご入力のうえ、ご利用 ください、詳しくは学会ホームページにて、 http://www.microscopy.or.jp/magazine/jem.html

投稿に関するお問い合わせ(日本語可) Microscopy 編集室 Email: microscopy.editorialoffice@oup.com

* Journal Citation Reports®, Thomson Reuters 2013

MICROSCOPY Editor's Choice より

日本顕微鏡学会が発行する欧文誌 Microscopy では、学術的なインパクトの大きい論文を"Editor's Choice"とし、オンライン 上にてフリー・アクセスで公開しています(http://imicro.oxfordjournals.org/). ぜひご一読ください. Microscopy は顕微鏡技術 を活用したインパクトの高い論文を発信する国際誌を目指しております. 投稿についての詳細はこちらから (http://www. microscopy.or.jp/magazine/jem.html).

(* Corresponding author)

A new grating X-ray spectrometer for 2–4 keV enabling a separate observation of In-Lß and Sn-La emissions of indium tin oxide

2-4 keV 用広帯域多層膜回折格子の開発と ITO の In-Lβ, Sn-Lα の分離計測

Masami Terauchi^{1,*}, Hideyuki Takahashi², Nobuo Handa², Takanori Murano², Masato Koike³, Tetsuya Kawachi³, Takashi Imazono³, Noboru Hasegawa³, Masaru Koeda⁴, Tetsuya Nagano⁴, Hiroyuki Sasai⁴, Yuki Oue⁴, Zeno Yonezawa⁴ and Satoshi Kuramoto4

寺内正己^{1,*}, 高橋秀之², 飯田信雄², 村野孝訓², 小池雅人³, 河内哲哉³, 今園孝志³, 長谷川登³, 小枝 勝⁴, 長野哲也⁴, 笹井浩行4,大上裕紀4,米澤善央4,倉本智史4

¹IMRAM, Tohoku University

²IEOL Ltd

³Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency ⁴Device Department, SHIMADZU Corp.

Microscopy (2013) 62(3): 391–395. doi: 10.1093/jmicro/dfs129 First published online: January 10, 2013

通常のAu コート回折格子を 用いた分光器では、2 keV 以 上において Au の反射率が極 端に小さくなるために測定が できない. そこで、2-4 keV の領域で実用可能な反射率を 実現する多層膜コーティング を新たに考案し、実際の収差 補正回折格子にコーティング を施した. この多層膜回折格 子を透過型電子顕微鏡に付設 した分光器に実装してテスト を行った結果, 1.5-4.3 keV



のエネルギー範囲で有意なスペクトル強度の測定ができることが 確認できた. また, Te-La (3.8 keV) ピークの半値幅で評価した エネルギー分解能は27 eV であった. この分光器を用い、透明電 極に使われる ITO の分析を行った. 汎用の EDS ではエネルギー 分解できない Sn-La (3444 eV) と In-Lβ (3487 eV) ピークを明 瞭に分離して観測できることが確認できた.

Visualization of two distinct states of disassembly in the bacterial V-ATPase from Thermus thermophilus

高度好熱菌 V 型 ATPase の2種類の解離中間体構造の可視化

Kazutoshi Tani¹, Christopher P. Arthur^{2,3}, Masatada Tamakoshi^{4,5}, Ken Yokoyama⁶, Kaoru Mitsuoka⁷, Yoshinori Fujiyoshi^{1,8} and Christoph Gerle9,*

谷 一寿¹、クリストファー P. アーサー^{2,3}、玉腰雅忠^{4,5}、 横山 謙⁶、光岡 薫⁷、藤吉好則^{1,8}、クリストフ ゲーレ^{9,*}

¹Cellular and Structural Physiology Institute, Nagoya University ²Department of Cell Biology, The Scripps Research Institute ³FEI Company

⁴Department of Molecular Biology, Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences

⁵RIKEN SPring-8 Center, Harima Institute

⁶Department of Molecular Biosciences, Kyoto Sangyo University ⁷Biomedical Information Research Center (BIRC). The National Institute

of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

⁸Department of Medicinal Science, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Nagoya University

⁹Career Path Promotion Unit for Young Life Scientists, Kyoto University

Microscopy (2013) 62(4): 467-474. doi: 10.1093/jmicro/dft020 First published online: April 9, 2013

V型 ATPase は、マルチサブ ユニットの膜タンパク質で、 エネルギー変換を行う生体分 子機械であり, サブユニット の離散・集合は生体内での活 性に直結している. in vitro でも V 型 ATPase は分解する 傾向があり,機能や構造的特 徴の決定を複雑にしている.



Fig. 4(b) より

これまで初期段階における解離中間体の立体構造情報は報告され ていない.我々は電子線トモグラフィーと電子結晶学双方を組み 合わせることによって、負染色した二次元単結晶中の高度好熱菌 V型 ATPase の立体構造を決定した.また,結晶の不均一性のた め電子線結晶学による三次元再構成に使用できる画像が少なすぎ るような脆弱な巨大分子複合体の二次元結晶の場合、本手法によ る単結晶からの三次元再構成が適切であることも示した.結晶中 の非対称単位に含まれる2つの異なる立体構造は、外周ストーク のうちの1本、あるいは2本とも外れたような解離初期の中間体 であるように見受けられ、外周ストークの解離初期における関与 が示唆された.

Novel convergence-oriented approach for evaluation and optimization of workflow in single-particle two-dimensional averaging of electron microscope images

電子顕微鏡像の単粒子二次元平均化における処理手順の評価 と最適化のための収束指向アプローチ

Toshio Moriya^{1,2}, Kazuhiro Mio^{2,*} and Chikara Sato^{2,*}

守屋俊夫^{1,2}, 三尾和弘^{2,*}, 佐藤主税^{2,*}

¹Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba

²Biomedical Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) タンパク質三次元構造の決定 は、生理学的作用機序の理解 のみならず、創薬にも貴重な 情報を提供する.結晶化が難 しいタンパク質には電子顕微 鏡像からの再構築である単粒 子解析が適しているが、対象 に特化した処理手順とパラ メータ条件の最適化が高分解 能達成に必要である.我々が 提案する複数指標値の収束傾



Fig. 3(d) より

向に注目した総合評価システム IC-EOS は、二次元平均化の挙動 と特徴を分析し定量化することにより処理結果を評価する.定量 指標として、計算サイクルごとの平均像の分解能と分散、平均像 グループ内の類似度、粒子像の並行移動量と回転角の五指標を選 び、全てを統合することでより信頼性の高い評価方法を確立した. そして、重要な条件である「除外した画像枚数」と「クラス分け グループ数」の処理結果への影響を検証した.NaChBac 事例研 究と GroEL 擬似投影像でのシュミレーションでは、より厳しい 粒子選別で分解能が向上した.一方、クラス数を減らすと分解能 は向上するが、類似度は悪化した.このように個別指標だけでは 確定的判断が困難な場合でも、総合評価は最適条件の自動選択に 成功した.IC-EOS は単粒子解析の全自動化への一歩を進めた.

Microscopy (2013) 62(5): 491–513. doi: 10.1093/jmicro/dft026 First published online: April 25, 2013

Phase-locking of oscillating images using laser-induced spin-polarized pulse TEM

レーザー駆動スピン偏極パルス TEM を用いたパルス位相同 期 TEM 像

Makoto Kuwahara^{1,*}, Yoshito Nambo¹, Soichiro Kusunoki¹, Xiuguang Jin², Koh Saitoh^{1,3}, Hidefumi Asano¹, Toru Ujihara¹, Yoshikazu Takeda¹, Tsutomu Nakanishi⁴ and Nobuo Tanaka^{1,3}

桑原真人^{1,*}, 南保由人¹, 楠聡一郎¹, 金 秀光², 齋藤 晃^{1,3}, 浅野秀文¹, 宇治原徹¹, 竹田美和¹, 中西 彊⁴, 田中信夫^{1,3}

¹Department of Engineering, Nagoya University ²Advanced Research Institute, Nagoya University ³EcoTopia Science Institute, Nagoya University ⁴Department of Science, Nagoya University

Microscopy (2013) 62(6): 607–614. doi: 10.1093/jmicro/dft035 First published online: June 23, 2013 電子スピンの制御を可能とし た電子ビーム源を透過型電子 顕微鏡に搭載することで,物 質のスピン情報を高い空間分 解能にて計測する分析手法 (スピン偏極 TEM)の開発を 進めている.スピン 偏極 TEM は、スピン偏極電子線 発生のためにレーザー駆動型 のNEA フォトカソードを電 子源に用いており、駆動レー ザー光源をパルス化する事で 容易にパルス電子線発生が可 能である.



Fig. 4 より

我々はこのフォトカソード型電子銃を用いて、5 μs パルス電子線 による TEM 像の取得に成功した. パルス電子線による像の取得 において、パルス化した効果を判断するために、結像系の偏向器 を1 kHz で周期的変調させた TEM 像を用いた. また、パルスレー ザーと偏向器制御系を同期させることで、パルス電子線と偏向器 を同期することに成功した. これにより、スピン分解と時間分解 を同時に実現する新たな電子顕微鏡の第一歩を踏み出した. さら に空間電荷効果を含めた粒子シミュレーションコードによりエ ミッションスポットサイズ 4 μm、パルス幅 10 ps において 5fC/ pulse の電荷量で最大輝度が達成されることが示唆された.